



IEC 電子部品品質認証制度 (IECQ)  
電子部品/組立部品/関連材料/関連工程  
IECQの規則及び詳細についてはウェブサイト参照 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)

## 認証書 独立試験所

IECQ 認証書番号:	IECQ-L JQAJP 13.0002	発行番号:	2	認証状況:	継続中
旧認証書番号:	IECQ-L JQAJP 13.0002 第 1 版	発行日:	2014/01/24	初回発行日:	2009/12/18
CB 管理番号:	JQAQ0002-001-T	有効期限:	2014/12/23		

沖エンジニアリング株式会社 本社  
〒179-0084 東京都練馬区氷川台 3-20-16 OEGビル

当該組織、設備及びその手順は、IECQ電子部品品質認証制度において、基本規則IECQ01、施行規則IECQ03-1「全IECQスキームの一般要求事項」、IECQ03-6「独立試験所審査プログラム要求事項」、及びISO/IEC17025:2005のIECQ制度における電子部品試験に適用される項目について審査の結果、独立試験所に要求される該当項目に適合することを確認しました。

認証範囲:

添付 附属書参照

発行認証機関 (CB):

IECQ メンバーボディ:

Japan Quality Assurance Organization (JQA)  
一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門

代表者:

近藤 繁 幸

ウェブサイト: [www.jqa.jp](http://www.jqa.jp)

Japanese Industrial Standards Committee

JISC - Japanese Industrial Standards Committee  
日本工業標準調査会

ウェブサイト: [www.meti.go.jp](http://www.meti.go.jp)

この認証の妥当性は、この認証書の発行認証機関による定期的なサーベイランス調査の実施によって維持されます。

注記: この認証は IECQ の施行規則に基づき、認証の停止又は取り消しとなる場合があります。

この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQの公式ウェブサイトを確認できます。 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)



附属書

独立試験所 認証書の範囲の詳細

IECQ 認証書番号: IECQ-L JQAJP 13.0002

CB管理番号: JQAQ0002-001-T

別添番号: IECQ-L JQAJP 13.0002-SJ

改訂番号: 2 改訂日: 2014/01/24

ページ 1 / 2

部品の種類

- QC 300000 (固定コンデンサ)
- QC 400000 (固定抵抗器)
- QC 230000 (プリント配線板)
- QC 700000 (半導体デバイス)

環境試験

- IEC 60068-2-1 (試験記号 A: 低温 (耐寒性) 試験)
- IEC 60068-2-2 (試験記号 B: 高温 (耐熱性) 試験)
- IEC 60068-2-11 (試験記号 Ka: 塩水噴霧試験)
- IEC 60068-2-14 (試験記号 N: 温度変化試験)
- IEC 60068-2-20 (試験記号 T: 端子付部品のはんだ付け性試験及びはんだ耐熱性試験)
- IEC 60068-2-30 (試験記号 Db: 温湿度サイクル試験 (12+12 時間サイクル))
- IEC 60068-2-38 (試験記号 Z/AD: 温湿度組合せ (サイクル) 試験)
- IEC 60068-2-42 (試験記号 Kc: 接点及び接続部の二酸化硫黄試験)
- IEC 60068-2-43 (試験記号 Kd: 接点及び接続部の硫化水素試験)
- IEC 60068-2-45 (試験記号 XA: 耐溶剤性試験)
- IEC 60068-2-52 (試験記号 Kb: 塩水噴霧 (サイクル) 試験)
- IEC 60068-2-54 (試験記号 Ta: はんだ付け性試験 (平衡法))
- IEC 60068-2-58 (試験記号 Td: SMD のはんだ付け性試験)
- IEC 60068-2-60 (試験記号 Ke: 混合ガス流腐食試験)
- IEC 60068-2-66 (試験記号 Cx: 高温高湿、定常 (不飽和加圧水蒸気) 試験)
- IEC 60068-2-78 (試験記号 Cab: 高温高湿 (定常) 試験方法)
- JIS C 60068-2-53 (試験記号 低温・高温/振動 (正弦波) 複合試験)

この附属書は、認証書と使用したときのみ有効です。

この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQの公式ウェブサイトを確認できます。 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)





附属書

独立試験所 認証書の範囲の詳細

IECQ 認証書番号: IECQ-L JQAJP 13.0002

CB管理番号: JQAQ0002-001-T

別添番号: IECQ-L JQAJP 13.0002-SJ

改訂番号: 2 改訂日: 2014/01/24

ページ 2 / 2

機械的試験

- IEC 60068-2-6 (試験記号 Fc: 正弦波振動試験)
- IEC 60068-2-21 (試験記号 U: 端子強度試験)
- IEC 60068-2-27 (試験記号 Ea: 衝撃試験)
- IEC 60068-2-31 (試験記号 Ec: 落下及び転倒試験)

強度試験

- EIAJ ED-4701 試験方法 304 (人体モデル静電破壊試験 (HBM/ESD) )
- EIAJ ED-4701 試験方法 305 (デバイス帯電モデル静電破壊試験 (CDM/ESD) )
- EIAJ ED-4701 試験方法 306 (ラッチアップ試験)

LED 光学特性試験

- JIS C 7801 (一般照明用光源の測定方法)
- JIS C 8152-1 (照明用白色発光ダイオード (LED) の測定方法—  
第1部: LED パッケージ)
- JIS C 8152-2 (照明用白色発光ダイオード (LED) の測定方法—  
第2部: LED モジュール及び LED ライトエンジン)
- JIS C 8105-5 (照明器具 — 第5部: 配光測定方法)

この附属書は、認証書と使用したときのみ有効です。  
この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。  
この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。  
この認証の認証状況及びその真偽については、IECQ の公式ウェブサイトを確認できます。 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)

